



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para todos los sistemas de prueba Keysight 307x con versión de software 9.2 o superior
- Exactitud de repetición, cobertura de pruebas y detección de errores mejoradas en comparación con la tecnología VTEP

Utilización

Las sondas de prueba nanoVTEP se utilizan para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura.

Respecto a las sondas de prueba nanoVTEP se trata de la más reciente solución de prueba para opens sin vectores de Keysight, que sustituye a las sondas de prueba VTEP. Además de la exactitud de repetición, cobertura de pruebas y detección de errores claramente mejoradas, las nuevas sondas de prueba nanoVTEP ofrecen una amplificación de hasta el 40% de las señales débiles, dado que el amplificador se encuentra situado cerca de la placa de sensor.

Las nuevas nanoVTEPs funcionan solo en combinación con los nanoVTEP MUX Boards. En una fixtura pueden utilizarse combinadas unas con otras tanto sondas de prueba nanoVTEP como también VTEP.



Datos generales

Grupo de productos:	Opens Test
Serie:	OTC
Tipo:	Prueba sin vectores Keysight
Modelo:	nanoVTEP Amplificador
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

INGUN SELECTION



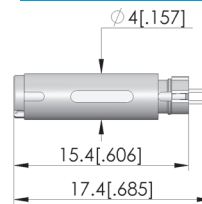
1:1

Nota:

Para realizar una ampliación de manera profesional de las sondas de prueba nanoVTEP Keysight se utilizan las instrucciones de ampliación INFO 4250.

Nota:

Las sondas de prueba nanoVTEP pueden utilizarse con seguridad en todos los sistemas de prueba Keysight 307x que cuenten con la versión de software 9.2 o superior. Si la versión de software que usted utiliza es anterior a la 9.2, por favor diríjase directamente al fabricante de sistemas de prueba Keysight.



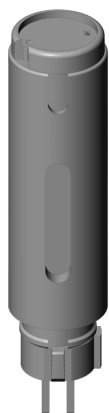
Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):
Juegos de recambio (WS):

VA 2070S/L

Datos técnicos

Longitud: 17,4 mm
Diámetro: 4 mm



Accessories

Part no.	Designation	Version
111606	OTC-KS-NV-GKS	nanoVTEP test probe
108704	OTC-KS-NV-SP-031-031	nanoVTEP sensor plate 1.2 inches
108705	OTC-KS-NV-SP-065-065	nanoVTEP sensor plate 2.5 inches
108706	OTC-KS-NV-SP-155-013	nanoVTEP sensor plate 152 mm x 12.5 mm
108710	OTE-KS-NV-064-MUX	nanoVTEP signal conditioner board
108711	OTE-KS-NV-064-MUX-REF	nanoVTEP signal conditioner board ConnectCheck

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

